# 低能 Pt 原子团簇沉积过程的分子动力学模拟\*

叶子燕 张庆瑜\*

(大连理工大学三束材料改性国家重点实验室,大连 116024) (2002年2月10日收到2002年3月25日收到修改稿)

利用分子动力学模拟系统研究了低能 Pt<sub>38</sub>, Pt<sub>141</sub>和 Pt<sub>266</sub>原子团簇与 P(001)表面的相互作用过程,详细分析了初始原子平均动能为 0.1,1.0 和 10eV 的原子团簇的沉积演化过程及其对基体表面形貌的影响.研究表明,初始原子 平均动能是描述低能原子团簇的重要参量.当团簇的平均原子动能较低时,团簇对基体表层原子点阵损伤较小,基本属于沉积团簇,随着入射团簇的原子平均动能的增加,团簇对表层原子点阵结构的破坏能力增强,当团簇的原子 平均动能增加到 10eV 时,团簇已经显现出注入特征.低能原子团簇对基体表面形貌的影响主要取决于团簇的初始 原子平均动能,但随着团簇所含原子数目的增加,低能原子团簇对基体表面的影响略有增强.此外,对低能原子团簇与基体表面相互作用的物理机理进行了讨论.

关键词:分子动力学模拟,低能原子团簇,载能沉积 PACC:6855

## 1.引 言

低能团簇与材料表面的相互作用在薄膜材料的 合成过程中有着重要的作用,一方面,在很多薄膜制 备过程中 如基于低温等离子体技术的化学气相沉 积(CVD)和物理气相沉积(PVD)、脉冲激光沉积 (PLD)以及电弧离子镀等薄膜制备技术中,气相成 分中常常存在等离子体尘埃颗粒和由大量原子构成 的液滴 这些低能团簇的存在对合成薄膜的质量将 产生严重的影响,另一方面,目前实验上已经发展出 了一些基于低能团簇沉积的薄膜制备技术 ,如 :离化 团簇束沉积(ionic cluster beam deposition 缩写为 ICBD).在低能团簇沉积技术中,团簇的大小和其所 携带的动能决定着合成薄膜的质量,人们利用低能 团簇技术已经制备出致密、光滑、膜基结合力优异的 薄膜材料[1-4].因此,研究低能团簇与材料表面的相 互作用,在原子水平上揭示低能原子团簇所产生的 薄膜表面微观过程的变化及其演化规律 ,无论是对 了解低能团簇沉积过程中薄膜生长的微观机理、改 进和优化薄膜合成工艺 ,还是对控制低能团簇对薄 膜的影响、提高合成薄膜的质量,均具有重要意义. 目前,有关低能团簇与材料表面相互作用的研究已

经受到国内外学者的广泛重视[5-13].

在以往的研究中,人们一般关注较小的原子团 簇,但是,无论是低能团簇沉积技术中的离化原子团 簇 还是薄膜沉积中产生的等离子体尘埃颗粒和液 滴,低能原子团簇中原子的数量可高达104,甚至更 大,低能团簇的原子平均动能一般在 0.1—10 eV.对 于如此复杂的薄膜生长过程,人们难以从实验的角 度研究低能团簇与薄膜生长表面相互作用的沉积动 力学过程以及在原子水平上揭示低能原子团簇所产 生的薄膜表面微观过程的变化及其演化规律 因此, 基于半经验原子间相互作用势的计算机模拟是研究 低能原子团簇与材料表面的相互作用的重要手段之 一.我们采用分子动力学模拟方法,系统研究了不同 低能 Pt 原子团簇与 Pt(001)表面的相互作用过程, 详细分析了入射原子平均动能为 0.1 .1.0 和 10eV 的原子团簇的沉积演化过程、团簇的原子平均动能 随时间的演化及其对基体表面形貌的影响.

### 2.模型与模拟方法

分子动力学模拟选择等温方案.等温近似所采 用的方法与 Berendsen 等<sup>14]</sup>提出的速度调整因子方 法相近,具体形式为

<sup>\*</sup>国家自然科学基金(批准号:10075009)资助的课题.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> 通讯联系人.大连理工大学物理系,大连 116024.E-mail:qyzhang@dlut.edu.cn

$$\chi = (T_{\rm sys}/T_{\rm cal})^{1/2} , \qquad (1)$$

$$T_{\rm cal} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i v_i^2}{\frac{3}{2} k (N - N_{\rm surf})}, \qquad (2)$$

式中 T<sub>sys</sub>为所设置的系统温度,N 为系统的总原子数,N<sub>suf</sub>为表面原子数,m<sub>i</sub>和v<sub>i</sub>分别为第i个原子的质量和速度.由于等温模型的实质是引入了对原子速度的一个约束,从而制约了原子的活性.原子运动活性,特别是表面原子的运动活性直接影响着基体的表面形貌.因此,在等温模型近似的情况下,为了使表面原子保持其运动活性,我们定义了一个表面原子层.表面原子层内的原子除受原子间相互作用的影响外,不受等温条件的限制,而且也没有其他任何人为的约束条件.有关模型的具体描述详见文献 15].

分子动力学模拟中的基体是一个具有周期性边 界、表面取向为(001)方向的平滑表面的计算单胞. 对应与  $P_{t_{38}}$ , $P_{t_{141}}$ 和  $P_{t_{266}}$ 原子团簇,单胞的体积分别 为  $12a_0 \times 12a_0 \times 5a_0$ , $20a_0 \times 20a_0 \times 5a_0$ 和  $30a_0 \times$  $30a_0 \times 8a_0$ ( $a_0 = 0.392$ nm为Pt的晶格常量),分别包 含有 2880 8000和 28800个Pt原子.原子间相互作 用势采用(embedded atom method 缩写为EAM)多体 势<sup>[16,17]</sup>,多原子体系的牛顿方程采用速度 Verlet 算 法求解<sup>[18]</sup>.由于低能团簇的原子平均动能为0.1,1.0 和 10.0 eV 三种典型的情况.模拟系统的初始温度 为 300K,在低能原子团簇入射之前,理想表面经过 了 3 ps 的等温弛豫,以保证基体表面的微观状态更 接近于真实薄膜生长时基体表面的初始状态.

## 3.结果与讨论

3.1. 低能团簇的原子平均动能随时间的演化

图 1 是团簇初始原子平均动能分别为 0.1 和 1.0 eV 的 Pt<sub>38</sub>, Pt<sub>141</sub>和 Pt<sub>266</sub>原子团簇的平均动能随沉 积时间的演化.从图 1 中可以看出,低能原子团簇在 接近表面的过程中,团簇的原子平均动能首先有一 个逐渐增加的过程,平均动能的净增加量为 0.05— 0.3 eV/atom.而且团簇原子平均动能的增加量随团 簇原子数目的增加而下降,而团簇原子平均动能的 增长时间与随团簇原子数目的增加而增加,随团簇 的初始原子平均动能的增加而缩短.这一结果说明, 团簇原子平均动能的增加的机理与单原子沉积过程 中入射原子动能的增加是相同的,即主要是团簇原 子与基体结合过程中释放结合能潜热的贡献<sup>[15]</sup>.与 单原子沉积所不同的是团簇中含有大量的原子,尽 管团簇在接近表面的过程中所释放的总原子间相互 作用势能(即结合能潜热)要远大于单原子沉积所释 放的结合能潜热,但是由于团簇动能的增加主要是 团簇表面原子的贡献,所以团簇的原子平均动能的 增加远小于单原子沉积.同时,随着团簇原子数目的 增加,表面原子在团簇原子中所占比重下降,因此导 致平均动能增加量的下降.此外,团簇的原子平均动 能的增长时间主要与团簇的沉积时间有关,团簇的 原子平均动能的增长时间随团簇的初始原子平均动 能的增加而缩短.



图 1 Pt<sub>38</sub>, Pt<sub>141</sub>和 Pt<sub>266</sub>原子团簇的平均动能 E<sub>a</sub> 随时间 t 的演 化 团簇初始原子平均动能 a)为 0.1eV (b)为 1.0eV

当团簇的原子平均动能达到最高后,开始迅速 下降,随后是一个震荡衰减过程.当团簇的原子平均 动能比较低时,团簇到达基体表面后,原子平均动能 的释放经历了一个较长的震荡衰减过程,而随着初 始原子平均动能增加,震荡现象不再明显.以上结果 说明,当低能原子团簇到达基体表面后,由于团簇原 子与表面原子间的碰撞而迅速将能量传递给基体原 子,使得入射点附近的基体温度迅速上升.当团簇的 平均原子动能较低时,基体表层原子间的金属键基 本能够承受团簇的冲击,使得基体的表层原子点阵 损伤较小.此时,表层原子点阵以发生依入射点为中 心的整体形变为主,团簇原子平均动能的震荡就是 这种表层原子点阵的形变势能逐渐释放的结果.随 着入射团簇的原子平均动能的增加,团簇对表层原 子点阵结构的破坏能力增强,入射团簇中心附近的 表层原子点阵不再保持完整,使得表层原子点阵的 形变势能引起的团簇原子平均动能的震荡衰减现象 不再明显.此外,我们发现,低能原子团簇的初始总 动能决定团簇原子弛豫到基体温度所需要的时间, 团簇初始总动能高,弛豫时间较长.

#### 3.2. 低能团簇的质心运动轨迹及射程

图 2 为不同初始原子平均动能的 Pt 原子团簇 在沉积过程中,团簇质心沿入射方向的坐标轨迹随 时间的演化.对于不同的团簇,团簇质心的初始下落 高度设定为  $H_o = R_{cat} + R_{cluster}$ ,其中  $R_{cat}$ 为原子间相 互作用势的截止半径, $R_{cluster}$ 为低能原子团簇的半 径.图 2 中虚线代表基体表面第一、第二和第三原子 层的 z 轴(低能原子团簇的入射方向)坐标位置.

通过团簇质心的运动轨迹可以看出 影响低能 原子团簇质心运动轨迹的主要因素是团簇的初始原 子平均动能.当团簇的初始原子平均动能较低时,团 簇到达基体表面后 团簇的质心运动轨迹呈现出明 显地波动 而且团簇的质心坐标高于基体表面原子 的位置坐标,说明此时的低能原子团簇对基体表面 没有较明显的破坏,低能团簇对基体表面的影响以 产生基体原子点阵的整体形变为主 团簇质心运动 轨迹的波动则源于基体原子点阵形变势能的释放. 当低能原子团簇的原子平均动能达到 10 eV 时,团 簇质心运动轨迹的波动现象已经明显减弱 此时的 团簇质心坐标基本在表面原子的位置坐标之下,这 一结果说明,当团簇的初始原子平均动能为 10 eV 时 团簇已经具有了对基体表面原子点阵产生破坏 的能力 此时基体的表面原子点阵不再以原子点阵 的整体形变为主,低能原子团簇已经在基体表面产 生较严重的晶格损伤.

同时,从图 2 中还可以看出,低能原子团簇质心的最终位置,即团簇原子的平均射程与团簇的初始 原子平均动能具有一定的联系.除了 Pt<sub>38</sub>因为团簇



图 2 (a)为  $Pt_{38}$  (b)为  $Pt_{141}$ 和(c)为  $Pt_{266}$ 原子团簇质心沿入射方 向的坐标轨迹  $d_c$ 随时间 t 的演化

半径较小而产生一定的偏差外 0.1 ,1.0 和 10eV 的 Pt 原子团簇的质心坐标分别为 0.5 ,0.25 和 -0.12nm.这一结果说明 ,尽管低能原子团簇的初始 总动能和团簇半径对团簇原子的平均射程有一定的 影响 ,但团簇原子的平均射程主要取决于团簇的原 子平均动能.从低能粒子与固体表面相互作用的角 度上看 ,低能原子团簇与基体表面的相互作用过程 与低能原子的沉积过程是类似的.即低能原子团簇 像一个质量和半径都很大的低能原子 ,只是低能原 子团簇的标识动能是原子平均动能 ,而不是团簇的 总动能.此外,根据团簇的质心坐标可以知道,0.1 和 1eV 的低能原子团簇基本位于基体表面以上,可 以认为此时的低能原子团簇是沉积团簇;而 10eV 的 低能原子团簇的质心已经位于基体表层原子以下, 显现出了一定的注入能力.这一结果与 Betz 和 Husinsky<sup>[12]</sup>关于 AI 团簇在 Cu(111)表面沉积的计算 机模拟结果是一致的.此外,分子动力学模拟结果与 实验上所观察到的随着原子平均动能的增加,薄膜 的膜基结合力增强,薄膜密度增加是一致的<sup>[4,19]</sup>.即 膜基结合力增强,薄膜密度增加是由于团簇所显示 出的注入能力所导致原子混合能力增强的结果.

3.3. 低能原子团簇对基体表面形貌和温度的影响

图 3 是初始原子平均动能分别为 0.1,1.0 和 10eV 的 Pt<sub>38</sub>原子团簇沉积到基体表面后的基体表面 形貌,其中黑色实心圆代表基体原子,白色空心圆代 表沉积团簇原子,从图3中可以看出:对于初始原子 平均能量为 0.1eV 的 Pta 团簇,基体表面原子仍保 持着完整的点阵结构,直观上看,初始原子平均动能 为 0.1eV 的低能原子团簇没有导致团簇原子与基体 原子的混合 基体表面几乎没有空位缺陷 仅产生了 少量的表面吸附原子.同时,低能原子团簇的结构也 比较完整 团簇在基体表面以表面岛的形式存在,当 团簇的初始原子平均动能为 1.0 eV 时 基体表面形 貌依然没有发生严重的形变,但此时团簇在基体表 面的影响区域已经略大于团簇的尺寸,基体表面出 现了少量的空位缺陷,产生的表面吸附原子也多于 初始原子平均动能为 0.1eV 的低能原子团簇,此时 团簇原子尽管没有较大的分离,但与基体原子发生 了一定程度的混合 团簇在基体表面所形成的表面 岛更为平坦.当初始原子平均动能为 10eV 时,低能 原子团簇对基体表面形貌产生了较大的影响 团簇 入射点附近的基体原子点阵发生了明显的变化,此 时团簇原子与基体原子间发生了明显的混合,基体 表面产生了大量的空位缺陷和表面吸附原子,团簇 已完全嵌入到基体之中,同时可以发现:低能原子团 簇的影响范围远大于团簇的尺寸,约为团簇直径的 2-3倍.

对于 Pt<sub>141</sub>和 Pt<sub>266</sub>低能原子团簇,基体表面形貌 随团簇初始原子平均动能的变化与 Pt<sub>38</sub>的影响相类 似.与 Pt<sub>38</sub>低能原子团簇所不同的是,随着团簇所含 原子数目的增加,低能原子团簇对基体表面的影响 略有增强.初始原子平均动能为 10 eV 的 Pt<sub>141</sub>团簇,



图 3 Pt<sub>38</sub>原子团簇对基体表面形貌的影响 ●为基体原子 ;○ 为团簇原子

已经可以产生基体表面原子的少量溅射;而初始原 子平均动能为 10 eV 的 Pt<sub>266</sub>团簇,不仅产生基体表 面原子的部分溅射,而且导致少量团簇原子的背散 射产生.这一结果与 Bouwen 等<sup>[20]</sup>在实验上所获得 的沉积团簇与表面碰撞过程中至少部分保持其团簇 形状的结论是完全一致的.同时,分子动力学模拟解 释了随着沉积原子平均能量的增加,薄膜表面形貌 光滑、界面混合增强等实验现象<sup>[4,19,20]</sup>.

上述结果说明,低能原子团簇对基体表面形貌 的影响主要取决于团簇的初始原子平均动能,但随 着团簇所含原子数目的增加,低能原子团簇对基体 表面的影响略有增强.对于初始原子平均动能较低 的低能原子团簇,由于此时团簇原子沉积到基体表 面时的原子平均动能较低,不足以严重破坏晶体点 阵原子间的金属键,低能原子团簇的作用是改变点 阵原子的局域构型,有利于薄膜生长表面原子点阵 和膜基界面的完整性.当团簇的初始平均动能为 10eV时,团簇原子的平均动能已经足以破坏晶体点 阵原子间的金属键,此时的低能原子团簇具有了一 定的注入能力.对于薄膜生长而言,原子平均动能较 高的低能原子团簇有利于薄膜生长过程中的界面混 合,增加膜基间的结合力.同时,由于原子平均动能 较高的低能原子团簇对晶体原子点阵具有较强的破 坏能力,有利于抑制薄膜表面三维岛的生长,增加薄 膜生长过程中的表面原子成核密度.

图 4 是初始原子平均动能分别为 0.1,1.0 和 10eV 的 Pt<sub>38</sub>原子团簇沉积过程中基体温度随时间的 演化.从图 4 中可以看出,当低能原子团簇到达基体 表面后,基体温度都有一定程度的增加,基体温度的 增加随沉积团簇动能的增加而增加,同时基体温度 弛豫回到初始基体温度所需要的时间也有所增加. 通过与团簇质心运动轨迹的对比可以发现,整个系 统的温度在低能原子团簇与基体表面接触时达到最 大值,随后开始振荡衰减.同时,不同尺度的低能原 子团簇对基体温度的影响具有类似的行为,但随着 低能原子团簇中原子数目的增加,整个系统的温度 弛豫回到初始基体温度所需要的时间显著增加.这 是因为整个系统的温度,取决于输入到系统中的总



图 4 不同初始原子平均动能的 Pt<sub>38</sub> 原子团簇对基体温度的 影响

能量.随着低能原子团簇中原子数目的增加,团簇提供给基体的总动能增加,整个模拟系统的散热过程 延长.

## 4.结 论

1. 初始原子平均动能是描述低能原子团簇的 重要参量.当团簇的平均原子动能较低时,团簇对基 体表层原子点阵损伤较小,表层原子点阵以发生依 入射点为中心的整体形变为主,团簇原子的动能以 震荡形式释放.随着入射团簇的原子平均动能的增 加,团簇对表层原子点阵结构的破坏能力增强,入射 团簇中心附近的表层原子点阵不再保持完整,使得 表层原子点阵的形变势能引起的团簇原子平均动能 的震荡衰减现象不再明显.

2. 尽管低能原子团簇的初始总动能和团簇半 径对团簇原子的平均射程有一定的影响,但团簇原 子的平均射程主要取决于团簇的原子平均动能,低 能原子团簇与基体表面的相互作用过程与低能原子 的沉积过程是类似的.初始原子平均动能为0.1 和 1eV 的低能原子团簇属于沉积团簇,当团簇的原子 平均动能增加到 10eV 时,团簇已经显现出注入 特征.

3. 低能原子团簇对基体表面形貌的影响主要 取决于团簇的初始原子平均动能,但随着团簇所含 原子数目的增加,低能原子团簇对基体表面的影响 略有增强.初始原子平均动能较低的低能原子团簇, 有利于薄膜生长表面原子点阵和膜基界面的完整 性,而原子平均动能较高的低能原子团簇有利于薄 膜生长过程中的界面混合和抑制薄膜表面三维岛的 生长.

4. 当入射团簇的原子平均动能低于表面晶格的结合键能时,基本无团簇原子分离现象;当入射团簇的原子平均动能大于表面晶格的结合键能时,团簇原子开始发生分离,不仅可以产生基体表面原子的部分溅射,而且导致团簇原子的背散射产生.

- [1] Yamada Y, Usui H and Takagi T 1986 Z. Phys. D 3 137
- [2] Yamada Y 1989 Appl. Surf. Sci. 43 23
- [3] Haberland H, Karrais M, Hall M and Thurner Y 1992 J. Vac. Sci. Technol. A 10 3266
- $\left[ \begin{array}{c} 4 \end{array} \right] \hspace{0.5cm}$  Haberland H , Mall M , Moseler M , Qiang Y , Reiners T and Thurner
- Y 1994 J. Vac. Sci. Technol. A 12 2925
- $\left[ \ 5 \ \right]$  Haberland H , Insepov Z , and Moseler M 1993 Z . Phys . D  $26 \ 229$
- [6] Luedtke W D and Landman U 1994 Phys. Rev. Lett. 73 569
- [7] Averback R S and Ghaly M 1994 Nucl. Instru. Meth. B 90 191
- [8] Lee R W, Pan Z Y and Ho Y K 1996 Phys. Rev. B 53 4156

- [9] Li R W, Pan Z Y and Ho Y K 1996 Acta Phys. Sin. 45 1113 (in Chinese ] 李融武、潘正瑛、霍裕昆 1996 物理学报 45 1113]
- [10] Pan Z Y and Li R W 1996 Acta Phys. Sin. 45 161 (in Chinese) [潘正瑛、李融武 1996 物理学报 45 161]
- [11] Xu Y, Pan Z Y and Wang Y X 2001 Acta Phys. Sin. 50 88 (in Chinese L 徐 毅、潘正瑛、王月霞 2001 物理学报 50 88 ]
- [12] Betz G and Husinsky W 1997 Nucl. Instru. Meth. B 122 311
- [13] Wang G H 1994 Progr. Phys. 14 121 (in Chinese)[王广厚 1994 物理学进展 14 121]
- [ 14 ] Berendsen H J C ,Postona J P M , Van Gunstern W F , Di Nola A

and Haak J R 1984 J. Chem. Phys. 81 3684

- [15] Zhang Q Y , Pan Z Y and Tang J Y 1999 Acta Phys. Sin. 8 296
- [16] Daw M S and Baskes M I 1984 Phys. Rev. B 29 6443
- [17] Foiles S M , Baskes M I and Daw M S 1986 Phys. Rev. B 33 7983
- [18] Verlet L 1967 Phys. Rev. 159 98
- [19] Yu G Q , Shi Y , Chai J W , Xie D Z , Pan H C , Yang G H , Cao J Q , Xu H J and Zhu D Z 1998 Nucl. Instru. Meth. B 135 382
- [20] Bouwen W , Kunnen E , Temst K , Thoen P , Van Bael M J , Vanhoutte F , Wedele H , Lievens P , and Silverans R E 1999 Thin Solid Films 354 87

## Molecular dynamics simulations of low-energy Pt cluster deposition \*

Ye Zi-Yan Zhang Qing-Yu<sup>†</sup>

(State Key Laboratory for Materials Modification by Laser, Ion and Electron Beams, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China) (Received 10 February 2002; revised manuscript received 25 March 2002)

#### Abstract

Molecular dynamics simulations have been applied to the investigation of the deposition of low-energy  $Pt_{38}$ ,  $Pt_{141}$ , and  $Pt_{266}$  clusters on P(001) surface. The evolution process of cluster deposition with atomic average kinetic energies ( $E_a$ ) of 0.1, 1.0 and 10eV and the effects on the substrate surface morphology have been analyzed. Simulation results show that  $E_a$  is an important parameter to describe behaviours of the clusters. Clusters with low  $E_a$  cannot damage the surface lattice seriously and the clusters can be considered as a deposition cluster. The power of cluster damaging surface lattice increases with the increase of  $E_a$ . When  $E_a = 10 \text{eV}$ , the clusters can implant into the substrate. The effects of low energetic clusters on substrate surface morphology are also determined by  $E_a$ . The effects of clusters with more atoms , however , are stronger than that with fewer atoms. The mechanisms of the interactions between low-energy clusters and substrate surface are also discussed in this paper.

**Keywords** : molecular dynamics simulation , low energy cluster , energetic deposition **PACC** : 6855

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10075009).

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>Author to whom correspondence should be addressed. Department of Physics , Dalian University , Dalian 116024 , China. E-mail : qyzhang@dlut.edu.cn